众星联恒 Top Unistar
Explore the unknown
极紫外、X射线服务及解决方案提供商

紧凑型可旋转X射线分辨率靶

用于CT几何校准和性能评估的高分辨率测试靶



紧凑型可旋转分辨率测试靶旨在实际扫描条件下评估高分辨率X射线CT系统的成像性能。其紧凑且兼容CT的结构设计，使其能够靠近射线源放置，从而实现对精细参考结构的旋转成像。

该测试靶具有正交的5对-线/空间阵列图案，特征尺寸从0.7 μm至7 μm，能够直观地评估两个方向上的空间分辨率。它非常适合用于分辨率验证、扫描参数优化、系统性能比对以及常规质量控制。

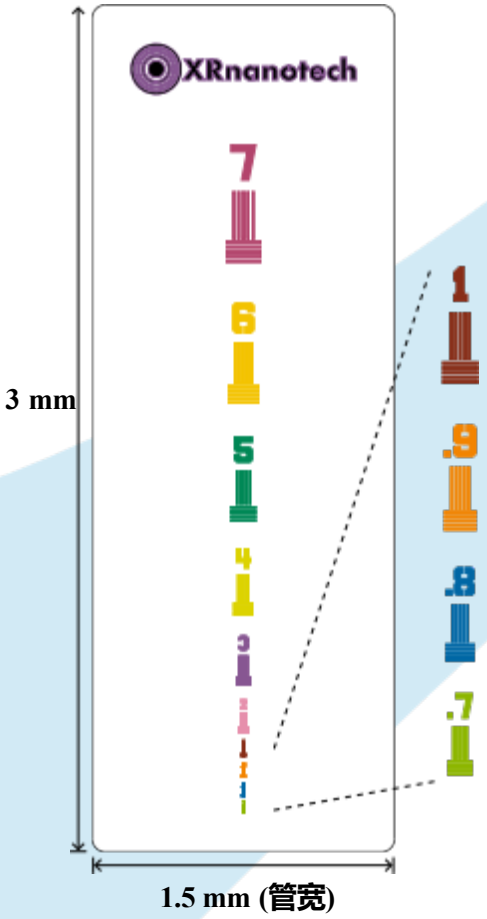


该测试靶采用先进的微纳加工工艺制造，其结构尺寸极其精确且高度可重复，并已通过扫描电子显微镜（SEM）检测验证。

众星联恒的合作伙伴XRnanotech是瑞士领先的高精度X射线光学器件、microCT 和 nanoCT 测试靶以及定制纳米结构制造商。我们将前沿的纳米加工技术与在X射线成像领域积累的深厚专业知识相结合，致力于帮助客户不断突破分辨率、精密计量和分析性能的极限。

紧凑型可旋转X射线分辨率靶

布局



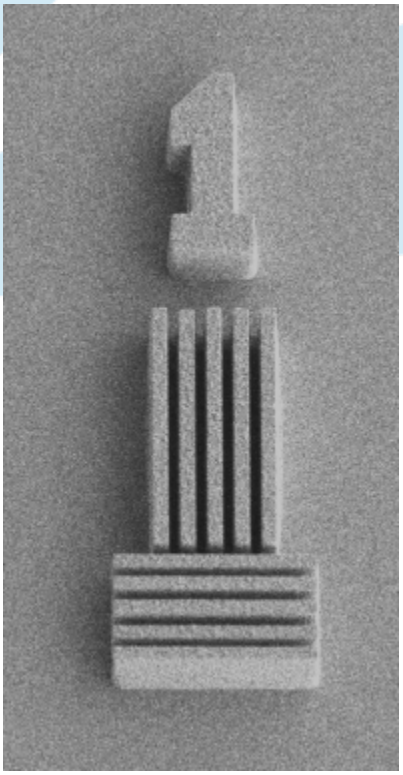
最先进的设计：

- **高分辨率：**关键尺寸=7-0.7 μm
- **高对比度：**金结构高度 >4 μm
- **紧凑型几何结构：**工作距离 >0.75 mm

规格

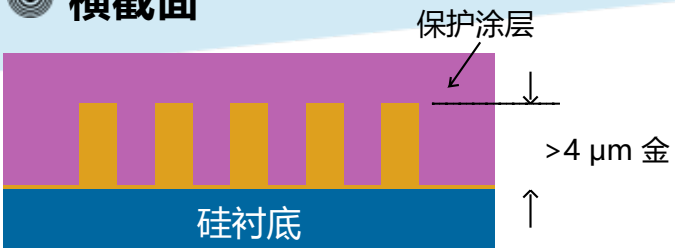
	规格	描述
芯片	设计	正交密集线/空间阵列图
	对比度材料	金 (H > 4 μm)
	线宽/线空间	0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 μm
	CD公差	±10%
	基底	Si (1.4 mm×3 mm×0.25 mm)
芯片支架	材料	PEEK
	尺寸	D 1.5 mm × H 40 mm
支杆	材料	不锈钢
	尺寸	D 3 mm× H 80 mm

测试靶认证



分辨率测试靶附带经认证的计量检测报告。采用高分辨率扫描电子显微镜（SEM）进行检测

横截面



联系我们！

sales@top-unistar.com

+86-10-86467571

北京市海淀区上地信息路1号

1-2号楼B栋